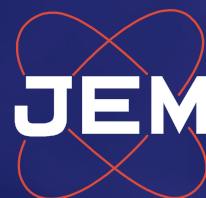


VC Series



■ 用途 Application

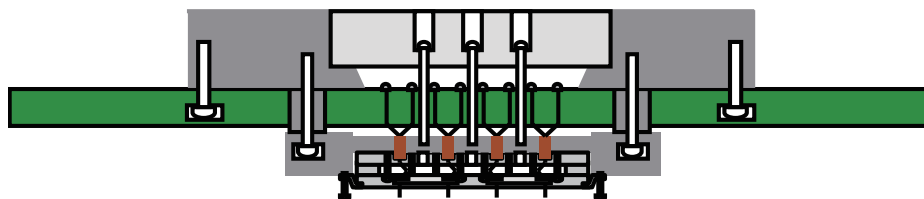
座屈応力構造の垂直型プローブカード。12インチサイズのウェハー一括コンタクトに対応しています。
VCシリーズはフラッシュメモリ測定に最適なプローブカードです。

■ 特長 Feature

1. 合金針の採用による安定した接触性
2. 全パッド均一の低スクラブ痕
3. 広範囲(低温から高温)の測定
4. 同時多数個測定によるテストコスト低減
5. 狭ピッチ対応

基本仕様 Specifications

パッドピッチ Pad Pitch	90 μ m	最大OD Max OD	180 μ m
パッドサイズ Pad size	□62 μ m	基板下面～針先 Probe Depth	12mm(Only)
針立て領域 Max Probe Area	ϕ 300 μ m	最大電流 Max Current	400mA
針位置精度 Alignment	\pm 7 μ m	使用温度 Temperature range	-40~150 $^{\circ}$ C
高さバラツキ Planarity	30 μ m	最大ピン数 Max Pin	15,000
推奨OD時の針圧 Probe force	4.0gf@OD=150 μ m		



※VC断面図

Your Probing Partner



JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION
日本電子材料株式会社

<http://www.jem-net.co.jp/>